

## Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

**Beliehene gemäß § 8 Absatz 1 AkkStelleG i.V.m. § 1 Absatz 1 AkkStelleGBV**  
Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen  
von EA, ILAC und IAF zur gegenseitigen Anerkennung

# Akkreditierung



Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH bestätigt hiermit, dass das Kalibrierlaboratorium

**Mahr GmbH**  
**Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen**

die Kompetenz nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 besitzt, Kalibrierungen in folgenden Bereichen durchzuführen:

### **Dimensionelle Messgrößen**

#### **Länge**

- **Rauheit**
- **Formabweichung**
- **Kontur**
- **Tastschnittgeräte <sup>a)</sup>**
- **Längenmessgeräte <sup>a)</sup>**

<sup>a)</sup> auch Vor-Ort-Kalibrierung

Die Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 19.12.2020 mit der Akkreditierungsnummer D-K-15074-01. Sie besteht aus diesem Deckblatt, der Rückseite des Deckblatts und der folgenden Anlage mit insgesamt 4 Seiten.

Registrierungsnummer der Urkunde: **D-K-15074-01-00**

Braunschweig, 19.12.2019

Im Auftrag Dr. Heike Manke  
Abteilungsleiterin



## Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

### Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15074-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

**Gültig ab: 19.12.2019**

Ausstellungsdatum: 19.12.2019

Urkundeninhaber:

**Mahr GmbH**  
**Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen**

Kalibrierungen in den Bereichen:

#### **Dimensionelle Messgrößen**

##### **Länge**

- **Rauheit**
- **Formabweichung**
- **Kontur**
- **Tastschnittgeräte <sup>a)</sup>**
- **Längenmessgeräte <sup>a)</sup>**

<sup>a)</sup> auch Vor-Ort-Kalibrierung

verwendete Abkürzungen: siehe letzte Seite

**Permanentes Laboratorium**

**Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)**

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit <sup>1)</sup>	Bemerkungen
<b>Länge</b> Rillentiefe <i>Pt</i> und <i>d</i> auf Tiefeneinstell- normalen	0,2 µm bis 0,8 µm 0,8 µm bis 1,5 µm 1,5 µm bis 3,5 µm 3,5 µm bis 12 µm	DIN EN ISO 3274:1998 DIN EN ISO 4287:2010 DIN EN ISO 5436-1:2000	0,03 µm 0,04 µm 0,04 µm 0,05 µm	
Rauheit auf superfeinen Raunormalen <i>Ra</i> <i>Rz</i> <i>Rmax</i>	0,025 µm bis 0,1 µm 0,15 µm bis 0,8 µm 0,15 µm bis 0,8 µm	DIN 4768:1990 DIN EN ISO 3274:1998 DIN EN ISO 4287:2010 DIN EN ISO 4288:1998 DIN EN ISO 16610-21:2013	0,08 · <i>Ra</i> 0,09 · <i>Rz</i> 0,10 · <i>Rmax</i>	
Rauheit auf Raunormalen <i>Ra</i> <i>Rz</i> <i>Rmax</i>	0,1 µm bis 4 µm 0,8 µm bis 20 µm 0,8 µm bis 20 µm	DIN 4768:1990 DIN EN ISO 3274:1998 DIN EN ISO 4287:2010 DIN EN ISO 4288:1998 DIN EN ISO 16610-21:2013	0,05 · <i>Ra</i> 0,05 · <i>Rz</i> 0,05 · <i>Rmax</i>	
Rauheit auf Raunormalen <i>Rpk</i> <i>Rk</i> <i>Rvk</i> <i>Mr1</i> <i>Mr2</i>	auf Oberflächen im Bereich 0,1 µm ≤ <i>Ra</i> ≤ 4 µm 0,8 µm ≤ <i>Rz</i> ≤ 20 µm	DIN 4768:1990 DIN EN ISO 13565-1:1998 DIN EN ISO 13565-2:1998	0,04 · <i>Rz</i> 0,05 · <i>Rz</i> 0,04 · <i>Rz</i> 4 % 6 %	Relative Messunsicher- heit bezogen auf <i>Rz</i>  Messunsicherheit bezogen auf 100 % Materialanteil
Rauheit auf Geometrie- normalen <i>Ra</i> <i>Rz</i> <i>Rmax</i>	0,1 µm bis 4 µm 0,8 µm bis 20 µm 0,8 µm bis 20 µm	DIN 4768:1990 DIN EN ISO 3274:1998 DIN EN ISO 4287:2010 DIN EN ISO 4288:1998 DIN EN ISO 16610-21:2013	0,03 · <i>Ra</i> 0,03 · <i>Rz</i> 0,03 · <i>Rmax</i>	Im Bedarfsfall kann die Filtergrenzwellenlänge <i>λc</i> eine Stufe kleiner oder größer als nach Norm verwendet werden.
Tastschnittgeräte nach DIN EN ISO 3274:1998 <i>Pt</i> und <i>d</i> <i>Ra</i> <i>Rz</i> <i>Rmax</i>	0,2 µm bis 12 µm 0,1 µm bis 4 µm 0,8 µm bis 20 µm 0,8 µm bis 20 µm	DKD-R 4-2 Blatt 2:2018 DIN EN ISO 12179:2000	$U_{Normal} + 0,01 \mu m$ $U_{Normal} + 0,01 \cdot Ra$ $U_{Normal} + 0,01 \cdot Rz$ $U_{Normal} + 0,01 \cdot Rmax$	$U_{Normal}$ = Messunsicher- heit der verwendeten Normale. Auch kleinere Mess- bereiche, für die Normale vorliegen, können kalibriert werden.

<sup>1)</sup> In den CMC sind die erweiterten Messunsicherheiten nach EA-4/02 M:2013 enthalten. Diese sind im Rahmen der Akkreditierung die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten mit einer Überdeckungswahrscheinlichkeit von etwa 95 % und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor  $k = 2$ . Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.

**Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15074-01-00**

**Permanentes Laboratorium**

**Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)**

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit <sup>1)</sup>	Bemerkungen
Rundheitsnormale Rundheitsabweichung	bis 0,1 µm	DIN ISO 1101:2014	0,025 µm	Durchmesser: 3 mm bis 100 mm
Vergrößerungsnormale Rundheitsabweichung Zylinder mit Abflachung (Flick)	0,5 µm bis 20 µm		$0,05 \mu\text{m} + 2,5 \cdot 10^{-2} \cdot RONt$	Durchmesser: 3 mm bis 100 mm
Vergrößerungsnormale Rundheitsabweichung Mehrwellennormal	bis 20 µm		$0,1 \mu\text{m} + 2,5 \cdot 10^{-2} \cdot RONt$	Durchmesser: 50 mm bis 150 mm
Prüfzylinder Rundheitsabweichung	bis 20 µm		$0,1 \mu\text{m} + 2,5 \cdot 10^{-2} \cdot RONt$	Durchmesser: 3 mm bis 100 mm
Geradheitsabweichung der Mantellinien	bis 20 µm		$0,2 \mu\text{m} + 2,0 \cdot 10^{-2} \cdot STRt$	Länge: 10 mm bis 400 mm
Parallelitätsabweichung der Mantellinien	bis 20 µm		$0,3 \mu\text{m} + 1,5 \cdot 10^{-2} \cdot PART$	$RONt$ = Rundheits- abweichung $STRt$ = Geradheits- abweichung
Zylinderform- abweichung	bis 20 µm		$0,4 \mu\text{m} + 3,0 \cdot 10^{-2} \cdot CYLt$	$PARt$ = Parallelitäts- abweichung $CYLt$ = Zylinderform- abweichung
Konturnormale Länge X Laterale Abstände	5 mm bis 100 mm	Substitutionsmessung mit BezugsKonturnormal	0,6 µm	
Länge Z Vertikale Abstände	bis 10 mm	Verfahren nach DIN ISO/TS 15530-3:2008	0,75 µm	
Radien	2 mm bis 12 mm		0,75 µm	
Winkel	40° bis 135°		0,01°	
Messuhren- und Feinzeigerprüfgeräte	bis 100 mm	MK03/05:2014 Kalibrierung mit einem rückgeführten inkre- mentalenen Bezugstaster	0,22 µm	
Horizontale Längenmessgeräte	0 mm bis 1000 mm > 1000 mm bis 2000 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 17.1:2014	$0,08 \mu\text{m} + 0,7 \cdot 10^{-6} \cdot l$ $0,1 \mu\text{m} + 0,5 \cdot 10^{-6} \cdot l$	$l$ = gemessene Länge Die Messunsicherheit ist die Längenmess- unsicherheit bei me- chanischer Antastung an Parallelendmaßen und ist gültig für hori- zontale Längenmess- geräte der Mahr GmbH

<sup>1)</sup> In den CMC sind die erweiterten Messunsicherheiten nach EA-4/02 M:2013 enthalten. Diese sind im Rahmen der Akkreditierung die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten mit einer Überdeckungswahrscheinlichkeit von etwa 95 % und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor  $k = 2$ . Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.

**Vor-Ort-Kalibrierung**

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit <sup>1)</sup>	
<b>Länge</b> Tastschnittgeräte nach DIN EN ISO 3274:1998 <i>Pt</i> und <i>d</i> <i>Ra</i> <i>Rz</i> <i>Rmax</i>	0,2 µm bis 12 µm 0,1 µm bis 4 µm 0,8 µm bis 20 µm 0,8 µm bis 20 µm	DKD-R 4-2 Blatt 2:2018 DIN EN ISO 12179:2000	$U_{\text{Normal}} + 0,01 \mu\text{m}$ $U_{\text{Normal}} + 0,01 \cdot Ra$ $U_{\text{Normal}} + 0,01 \cdot Rz$ $U_{\text{Normal}} + 0,01 \cdot Rmax$	$U_{\text{Normal}}$ ist die Mess- unsicherheit der ver- wendeten Normale. Auch kleinere Mess- bereiche, für die Normale vorliegen, können kalibriert werden.
Messuhren- und Feinzeigerprüfgeräte	bis 100 mm	MK03/05:2014 Kalibrierung mit einem rückgeführten inkre- mentalen Bezugstaster	0,22 µm	
Horizontale Längenmessgeräte	0 mm bis 1000 mm > 1000 mm bis 2000 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 17.1:2014	$0,08 \mu\text{m} + 0,7 \cdot 10^{-6} \cdot l$ $0,1 \mu\text{m} + 0,5 \cdot 10^{-6} \cdot l$	$l$ = gemessene Länge Die Messunsicherheit ist die Längenmess- unsicherheit bei me- chanischer Antastung an Parallelendmaßen und ist gültig für hori- zontale Längenmess- geräte der Mahr GmbH

**verwendete Abkürzungen:**

CMC	Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmöglichkeiten)
DIN	Deutsches Institut für Normung e.V.
DKD-R	Richtlinie des Deutschen Kalibrierdienstes (DKD), herausgegeben von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt
VDE	Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik
VDI	Verein Deutscher Ingenieure
MK	Kalibrieranweisung der Mahr GmbH

<sup>1)</sup> In den CMC sind die erweiterten Messunsicherheiten nach EA-4/02 M:2013 enthalten. Diese sind im Rahmen der Akkreditierung die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten mit einer Überdeckungswahrscheinlichkeit von etwa 95 % und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor  $k = 2$ . Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.